Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/052,758	DEBEER ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Ann Schillinger	3774	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
606	151, 157, 213, 215	11/2/2007	AS	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	-			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
-				

	DATE	EXMR
	·	
·		
<u> </u>		
	·	